

粗晶探头

纵波探头能适用于检测粗晶材料、原始的铸造材料，奥氏体和奥氏体焊缝等。



对于普通探头，由于粗晶粒结构所产生的噪声幅度与小缺陷的回波幅度基本一致，这样容易造成缺陷漏检。所以，检测粗晶材料时要选用特殊探头。有些探头可以检测部分奥氏体焊缝，并得到一些满意的结果，这主要取决于被检测材料的声学特性。

我们一直致力于解决这个问题，我们选择不同焦点的单晶探头和TR探头进行实验，得到检测粗晶材料的最佳探头参数。与此同时，我们得到了奥氏体材料制造商的大力支持。根据我们的经验和实验，我们针对各种粗晶粒材料设计了相应的探头，这些探头都取得了最佳的效果。此

外，这些测试结果还获得了最佳信噪比，并且所有的粗晶探头都通过纵波探伤。

具有可更换保护膜直探头

产品编码	频率 (MHZ)	晶体 (mm) Ø	接触面 (mm)	附注
K 0.5 S	0.5	34	40	高阻尼 高灵敏度 非常好的信噪比
K 1 S	1	34	40	
K 1 SM	1	28	33	
B 0.5 SL	0.5	34	40	非常好的灵敏度 高阻尼，高信噪比
B 1 SL	1	34	40	
K 1 SC	1	24	30	复合材料压电晶片 最好的灵敏度和信噪比
K 1 SC	2	24	30	

附件：1. 45度纵波楔块（可以要求其他角度的楔块）

2. 薄膜
3. 探头线

纵波斜探头—单晶系列，复合材料压电晶片

型号	角度 (°)	频率 (MHz)	晶片 (mm) Ø	接触面 (mm)	深度范围 (mm)	要求的探头线
WRY 45	45	2	24	48 × 25	5 - 100	MPKL 2
WRY 60	60	2	24	48 × 25	5 - 80	
WRY 70	70	2	24	48 × 25	5 - 55	
WSY 45-2	45	2	10	28 × 13	6 - 25	MPKL 2
WSY 60-2	60	2	10	28 × 13	4 - 20	
WSY 70-2	70	2	10	28 × 13	3 - 15	
WSY 45-4	45	4	10	28 × 13	3 - 30	MPKL 2
WSY 60-4	60	4	10	28 × 13	3 - 20	
WSY 70-4	70	4	10	28 × 13	2 - 15	

双晶系列纵波斜探头—复合材料压电晶片

型号	角度 (°)	频率 (MHz)	晶片 (mm) Ø	接触面 (mm)	深度范围 (mm)	要求的探头线
VRY 45	45	1,8	22 × 10	53 × 29	15 - 70	SEKL 2
VRY 60	60	1,8	22 × 10	53 × 29	10 - 60	
VRY 70	70	1,8	22 × 10	53 × 29	5 - 45	
VSY 45	45	4	10 × 5	30 × 15	2 - 30	SEKN 2
VSY 60	60	4	10 × 5	30 × 15	1.5 - 20	
VSY 70	70	4	10 × 5	30 × 15	1.5 - 20	